

ものづくり中小企業における 観察技術の活用

～見えなかった現象が見えてくる！？～

参加無料!!

従来技術の改善や新商品開発では、
現象を適切に観察することが一つの重要な要素です。

この際、観察の目的を適切に設定し、使用する機器の特性を正しく捉えて実施することが
有効になります。このような観点から、機器活用および商品開発の事例をご紹介します。

令和元年7月24日（水） 13:30～16:30

会場：ホテルグリーントワー幕張 3F チェルシー（千葉県美浜区ひび野2-10-3）

<http://www.greentower.co.jp/>

定員：70名（定員になり次第、締め切ります）

講演内容（講演順）

テーマ『走査電子顕微鏡の像形成と材料観察への応用』

講師：国立研究開発法人産業技術総合研究所 主任研究員 熊谷 和博 氏

走査電子顕微鏡(SEM)は簡便な表面形状観察手法として広く普及していますが、昨今のSEMの発展により形状以外にも様々な情報が得られるようになりました。こういった多様なSEM像を如何にして解釈し材料観察に活用していくか、像形成原理の観点から議論したいと思います。

テーマ『研究・開発・生産技術で活用される高速度カメラ』

講師：株式会社フォトン チーム長 鈴木 祐介 氏

研究・開発・生産技術で使用される高速度カメラの具体的な事例を紹介しながら、高速度撮影高速度撮影以外のセンサー測定情報を複合させた活用事例（同時計測・画像解析）を紹介いたします。

テーマ『パウダーテックの研究開発～評価技術・解析機器と研究開発事例のご紹介～』

講師：パウダーテック株式会社 市場開発部 部長 小林 弘道 氏

当社の開発するフェライト粒子は、プリンターや複合機の現像剤（電子写真用キャリア）、電磁波シールド、インダクター等の電子部品など、幅広く使用されています。これらのフェライト粒子の設計開発について、評価技術・解析装置の活用例を中心に紹介します。

テーマ『千葉県産業支援技術研究所のご紹介』

講師：千葉県産業支援技術研究所

千葉県産業支援技術研究所で近年導入した最新機器を活用例とともにご紹介します。

参加希望の方は、参加申込書に必要事項をご記入の上令和元年7月19日(金)までに、FAX (047-426-9044) にてお申込みください。
 なお、定員(70名)を超えてお受けできない場合のみ、こちらから連絡いたします。



- アクセス (電車でお越しの場合)
 - JR「東京駅」より快速で約35分
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」よりJR線乗換え快速で約30分
 - 東京メトロ有楽町線「新木場駅」よりJR線乗換え各駅停車で約25分
- アクセス (車でお越しの場合)
 - 東京方面から
東関東自動車道「湾岸習志野I.C.」より約5分
 - 千葉方面から
東関東自動車道「湾岸千葉I.C.」より約5分
京葉道路「幕張I.C.」から約10分
国道357号「若葉2丁目」より約2分

令和元年度第1回ちば新事業創出ネットワークセミナー
 参加申込書 (このままFAXしてください)

企業名			
住所	〒		
連絡担当者	(所属・役職名)	(氏名)	
TEL		FAX	
参加者	所属・役職名	氏名	

【申込先・問い合わせ】
 公益財団法人千葉県産業振興センター 新事業支援部 産学連携推進室 (担当: 秦)
 〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋 1F
 TEL 047-426-9200 FAX047-426-9044